

УДК 537.312.62

©1993

МАГНИТОУПРУГИЕ АНОМАЛИИ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ LiRF_4 , $R = \text{Ho}, \text{Tm}, \text{Lu}$

Р.Ю.Абдулсабиров, З.А.Казей, С.Л.Кораблев, Д.Н.Терпиловский

Экспериментально и теоретически исследовано влияние ионов редких земель на тепловое расширение ионных кристаллов LiRF_4 . Рентгенографическим методом измерены параметры a и с тетрагональной кристаллической решетки LiRF_4 в области температур 10–290 К. С учетом штарковской структуры уровней энергии ионов Tm^{3+} и Ho^{3+} выполнен микроскопический расчет малых изменений параметров a и c , обусловленных магнитоупругой связью. На этой основе объяснены аномалии теплового расширения кристаллов LiTmF_4 и LiHoF_4 в сравнении с диамагнитной матрицей LiLuF_4 .

Ряд физических свойств редкоземельных (РЗ) ионных кристаллов зависит от наличия в энергетическом спектре РЗ ионов уровней энергии, расщепленных кристаллическим полем на величину порядка 100 cm^{-1} . При изменении температуры в этом интервале могут наблюдаться аномалии магнитной восприимчивости, теплоемкости и скорости распространения звука [1,2], а при наложении магнитного поля может наблюдаться магнитострикция, достигающая иногда гигантской величины [3,4].

Целью данной работы является исследование влияния ионов редких земель R^{3+} на тепловое расширение ионных кристаллов LiRF_4 , для которых характерна большая величина магнитоупругой связи [2,4]. В области низких температур для кристаллов, содержащих РЗ ионы с незаполненной $4f$ -оболочкой, следует ожидать аномальной температурной зависимости параметров кристаллической решетки по сравнению с диамагнитной матрицей LiLuF_4 .

1. Эксперимент

Кристаллы LiRF_4 имеют структуру шеелита [5], пространственная группа $C_{4h}^6(I4_1/a)$, решетка Браве — объемно-центрированная Γ_q^v элементарная ячейка — содержит две формулярные единицы. Два иона R^{3+} занимают в элементарной ячейке эквивалентные положения, группа симметрии которых S_4 . Используемые в работе образцы в виде плоских пластинок размером 1–2 мм и толщиной 0,5–1 мм были вырезаны из монокристаллов, выращенных методом Бриджмена из расплава с помощью предварительно ориентированной затравки.

Рентгенографические исследования параметров a и c тетрагональной элементарной ячейки проводились на дифрактометре «Гейгерфлекс» с

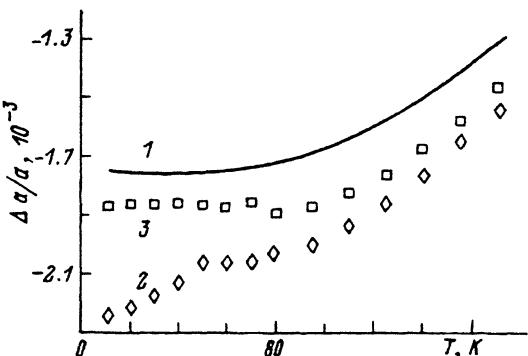


Рис. 1. Температурные изменения относительного параметра $\Delta a/a$ тетрагональной ячейки кристаллов LiLuF_4 (1), LiTmF_4 (2) и LiHoF_4 (3).

проточным гелиевым криостатом CF-108 (Oxford Instruments). Температурные измерения были выполнены на монокристаллических пластинках с ориентацией (100) и (001) по рефлексам (600) (излучение $\text{Co}K_{\beta}$, интенсивность $1 + 4 \cdot 10^3$ имп./с, $2\Theta \simeq 140 \div 144^\circ$) и (0012) (излучение $\text{Co}K_{\beta}$, интенсивность $2 \div 8 \cdot 10^3$ имп./с, $2\Theta \simeq 130 \div 134^\circ$). Относительная ошибка измерения параметров a и c по температуре составляла $2 \cdot 10^{-5}$.

На рис. 1, 2 представлены экспериментальные температурные зависимости параметров a и c соответственно трех исследованных кристаллов. Приведены относительные изменения этих параметров, нормированные на их значения при комнатной температуре, например $\Delta a/a = (a(T) - a)/a$, где $a = a$ (290 К). Такая нормировка позволяет исключить влияние систематической ошибки измерения параметров a и c , связанной с юстировкой кристалла. В области температур 150–290 К, не указанной на рис. 1, 2, все три кривые monotонно стремятся к точке с координатами (290 К, 0).

Для кристалла LiLuF_4 , содержащего ионы Lu^{3+} с полностью заполненной $4f$ -оболочкой, наблюдаются обычное дебаевское изменение параметров с температурой и незначительная анизотропия теплового расширения вдоль и перпендикулярно тетрагональной оси: $\Delta a(10 \text{ K})/a = 17.5 \cdot 10^{-4}$, $\Delta c(10 \text{ K})/c = 16.0 \cdot 10^{-4}$. Зависимости $\Delta a/a$ и $\Delta c/c$ для Тм и Но фторидов заметно отклоняются от соответствующих зависимостей LiLuF_4 при низких температурах. Наиболее отчетливо этот эффект проявляется для LiTmF_4 . Видно, что при 10 К кривая $\Delta c/c$ проходит выше примерно на $1.5 \cdot 10^{-4}$, а $\Delta a/a$ — ниже на $4.5 \cdot 10^{-4}$, чем для LiLuF_4 , и при $T \simeq 50 \text{ K}$ на зависимости $\Delta a/a$ наблюдается аномалия.

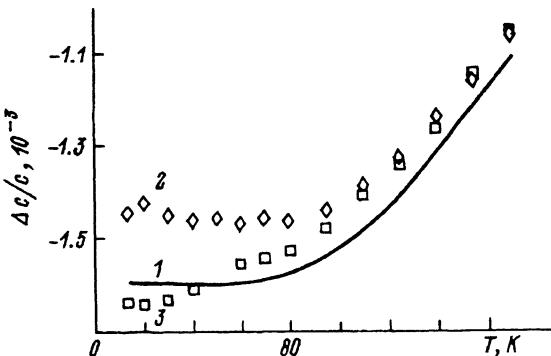


Рис. 2. Температурные изменения относительного параметра $\Delta c/c$ тетрагональной ячейки кристаллов LiLuF_4 (1), LiTmF_4 (2) и LiHoF_4 (3).

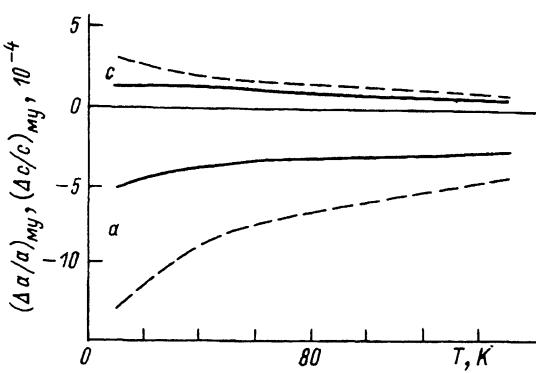


Рис. 3. Магнитоупругие аномалии $(\Delta a/a)_{\text{мж}} = (e_2^{\text{мж}}(T) - e_2^{\text{мж}}(290 \text{ К}))$ и $(\Delta c/c)_{\text{мж}} = (e_1^{\text{мж}}(T) - e_1^{\text{мж}}(290 \text{ К}))$ для LiTmF_4 (*a* и *c* соответственно). Тонкие линии — эксперимент, штриховка — расчет по формулам (3).

Поскольку фононный вклад в тепловое расширение Lu и Tm фторидов с большой точностью одинаков, наблюдаемое отклонение обусловлено магнитоупругим вкладом ионов Tm^{3+} . Аналогичные, но менее ярко выраженные особенности обнаружены также и для LiHoF_4 . Значения $\Delta a/a$ и $\Delta c/c$ при температурах ниже ~ 80 К приближаются в этом случае к соответствующим значениям LiLuF_4 , а пересечение кривых $\Delta c/c$ Ho и Lu фторидов находится, по-видимому, за пределами точности эксперимента. Отметим, что как для Tm, так и для Ho соединений наибольшая магнитоупругая добавка в тепловое расширение наблюдается для параметра *a*.

Для количественной оценки величины магнитоупругих аномалий $(\Delta a/a)_{\text{мж}}$ и $(\Delta c/c)_{\text{мж}}$ кристаллов LiTmF_4 и LiHoF_4 можно использовать в качестве эталонных соответствующие значения для LiLuF_4 , так как массовые числа всех трех РЗ ионов отличаются незначительно.

На рис. 3 приведен полученный таким образом из эксперимента магнитоупругий вклад вместе с результатами расчета для LiTMF_4 (штриховые кривые).

2. Интерпретация

Обнаруженные на опыте температурные аномалии параметров *a* и *c* кристаллов LiTmF_4 и LiHoF_4 свидетельствуют о заметном влиянии электронной подсистемы РЗ ионов на кристаллическую решетку. Для расчета этого влияния необходимо вычислить поправки к свободной энергии кристалла, обусловленные электрон-деформационным взаимодействием в линейном по деформациям приближении, и, минимизируя свободную энергию, получить вызванный указанным взаимодействием магнитоупругий вклад в относительную деформацию решетки.

Одноионный оператор электрон-деформационного взаимодействия запишем в виде [6]

$$H = \sum_{m,n} [A_m^n e_1 + B_m^n] o_m^n \equiv Ae_1 + Be_2, \quad (1)$$

где $e_1 = e_{zz}$, $e_2 = (e_{xx} + e_{yy})/2$ — компоненты тензора деформаций, преобразующиеся по представлению A_g группы симметрии кристалла C_{4h}^6 ; O_m^n — эквивалентные электронные операторы Стивенса; A_m^n и B_m^n — параметры, вычисленные в [6] в рамках теории обменных зарядов. В (1)

выписана только часть оператора электрон-деформационного взаимодействия, линейная по полносимметричным компонентам e_1 и e_2 тензора деформаций, так как тепловое расширение кристалла не меняет его симметрию. В соответствии с этим электронные операторы A и B в (1) также преобразуются по представлению \tilde{A}_g ; индексы m и n принимают следующие значения: $m = 2, n = 0; m = 4, n = 0, \pm 4; m = 6, n = 0, \pm 4$.

Штарковская структура уровней энергии основных термов ионов Tm^{3+} ($4f^{12}, ^3H_6$) и Ho^{3+} ($4f^{10}, ^5I_8$) и волновые функции состояний ионов в кристаллическом поле $LuRF_4$ приведены в [2, 7]. Воспользуемся этими данными и рассчитаем линейные по деформациям e_1 и e_2 поправки к свободной энергии (отнесенной к единице объема) кристалла

$$F = F_0 + \frac{1}{2}e\tilde{C}\epsilon + \frac{k}{V_0}(\langle A \rangle e_1 + \langle B \rangle e_2) + \dots, \quad (2)$$

где \tilde{C} — тензор упругих постоянных [8], $k = 2$ — число ионов на элементарную ячейку объемом $V_0 = ac^2/2$, $\langle A \rangle$ и $\langle B \rangle$ — усредненные по Больцману ожидаемые значения операторов A и B из (1) типа

$$\langle A \rangle = \sum_i g_i \langle i | A | i \rangle \exp(-E_i/kT) / \sum_i g_i \exp(-E_i/kT),$$

$|i\rangle$, E_i и g_i — волновая функция, энергия и степень вырождения штарковского состояния i РЗ иона.

Минимизируя (2), легко получить равновесные деформации решетки, возникающие за счет магнитоупругой связи

$$\begin{aligned} \frac{\delta c^{\text{my}}(T)}{c} &= e_1^{\text{my}} = -\frac{k}{V_0}(S(11)\langle A \rangle + S(12)\langle B \rangle), \\ \frac{\delta a^{\text{my}}(T)}{a} &= e_2^{\text{my}} = -\frac{k}{V_0}(S(21)\langle A \rangle + S(22)\langle B \rangle), \end{aligned} \quad (3)$$

где

$$S(11) = S_{33}, \quad S(12) = S(21) = S_{13}, \quad S(22) = (S_{11} + S_{12})/2$$

— линейные комбинации компонент S_{ik} тензора упругих податливостей [8].

Рассчитанные по формуле (3) значения величин

$$(\Delta c/c)_{\text{my}} = (e_1^{\text{my}}(T) - e_1^{\text{my}}(290 \text{ K})), \quad (\Delta a/a)_{\text{my}} = (e_2^{\text{my}}(T) - e_2^{\text{my}}(290 \text{ K}))$$

для кристалла $LiTmF_4$ сопоставлены с результатами эксперимента на рис. 3. Видно, что теория удовлетворительно описывает данные эксперимента — правильно воспроизводятся знак, величина и особенности температурной зависимости магнитоупругих поправок к параметрам решетки. Немонотонное изменение производных по температуре кривых $(\Delta a/a)_{\text{my}}$ и $(\Delta c/c)_{\text{my}}$, наблюдающееся при $T \approx 50$ К, связано с наличием в спектре энергии иона Tm^{3+} первого штарковского возбужденного уровня с энергией 44.9 К.

Подобные расчеты величин $e_{1,2}^{\text{my}}(T)$ для кристалла $LiHoF_4$ позволяют удовлетворительно объяснить лишь температурное изменение $(\Delta a/a)_{\text{my}}$,

тогда как $(\Delta c/c)_{\text{му}}$ во всем температурном интервале оказывается отрицательным и равным по абсолютной величине $(1 \div 2) \cdot 10^{-4}$, что не соответствует экспериментальным данным (рис. 2).

Обнаруженные на эксперименте особенности теплового расширения кристаллов LiRF_4 с Тм и Но объяснены в работе с единой микроскопической точки зрения. При сравнении теории с экспериментом мы исходили из самой общей формы оператора электрон-деформационного взаимодействия (1), которая допускается симметрией кристалла, и не использовали подгоночных параметров, как это обычно делается при феноменологическом подходе.

Наши расчеты показали, что в магнитоупругую деформацию решетки LiTmF_4 и LiHoF_4 вносят примерно одинаковый вклад все допускаемые симметрией семь мультипольных моментов $\langle O_m^n \rangle$ искаженной кристаллическим полем $4f$ -оболочки ионов Tm^{3+} и Ho^{3+} (см. с(3), где температурные средние операторов $\langle A \rangle$ и $\langle B \rangle$ имеют структуру $\langle A \rangle = \sum_{m,n} A_m^n \langle O_m^n \rangle$).

В этом заключается отличие нашей работы от подобных исследований, в которых в операторе электрон-деформационного взаимодействия без достаточного на то основания удерживаются лишь некоторые, а не все допускаемые симметрией операторы электронных мультипольных моментов типа O_m^n (иногда ограничиваются просто оператором квадрупольного момента O_2^0). В нашем случае сравнительно высокая симметрия окружения РЗ ионов в кристалле LiRF_4 позволила провести все вычисления до конца и получить удовлетворительное согласие эксперимента и теории для фторидов, содержащих некрамерсовые ионы с четным числом $4f$ -электронов. Упомянутое выше расхождение для LiHoF_4 связано, по-видимому, с неточностью расчета [6] параметров A_m^n и B_m^n в (1).

В настоящее время планируется провести аналогичные исследования с кристаллами, содержащими ионы всего РЗ ряда. Сравнение результатов данной работы с результатами подобного исследования [9], выполненного на РЗ фосфатах RPO_4 , $\text{R} = \text{Y}, \text{Tb} - \text{Yb}$, показывает, что абсолютная величина магнитоупругой аномалии в тепловом расширении фторидов LiRF_4 оказывается примерно в 2–3 раза меньшей.

Список литературы

- [1] Mullen M.E., Luthi B., Wang P.S., Bucher E., Longinotti L.D., Maita J.P., Ott H.R. // Phys. Rev. 1974. V. B10. P. 186–192.
- [2] Аухадеев Ф.Л., Жданов Р.Ш., Теплов М.А., Терпиловский Д.Н. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 8. С. 2225–2230.
- [3] Белов К.П., Соколов В.И., Тхак Дык Хиен // ФТТ. 1968. Т. 12. № 10. С. 3706–3712.
- [4] Альтшуллер С.А., Кротов В.И., Малкин Б.З. // Письма ЖЭТФ. 1980. Т. 32. № 10. С. 232–234.
- [5] Christensen H.P. // Phys. Rev. 1978. V. B17. P. 4060–4065.
- [6] Винокуров А.В., Кораблева С.Л., Малкин Б.З., Поминов А.И., Столов А.Л. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 3. С. 801–805.
- [7] Малкин Б.З. // Автореф. докт. дис. Казань, 1985.
- [8] Blanchfield P., Saunders G.A. // J. Phys. C. 1979. V. 12. N 24. P. 4673–4680.
- [9] Соколов В.И., Казей З.А., Колмакова Н.П., Соловьевна Т.В. // ЖЭТФ. 1991. Т. 99. № 3. С. 945–961.